## Dr. Corneliu Ghica, Chercheur scientifique 1er rang

Expert: D137 (Physique)

Lieu et date de naissance : Pitesti, Roumanie, le 31 Octobre 1969

Nationalité: Roumaine

Lieu de travail actuel: Institut National de Physique des Matériaux, 405A Rue Atomiștilor, 077125 Măgurele,

Ilfov. Roumanie: tel: +40213690185: fax: +40213690177.

Adresse électronique: cghica@infim.ro

## Parcours universitaire:

**1989-1994** : Licence - Faculté de Physique de l'Université de Bucarest, spécialité « Physique : ingénierie optique, spectroscopie optique et technologies laser »

**1994-1995 : Master** - Faculté de Physique de l'Université de Bucarest, spécialité « Physique : ingénierie optique, spectroscopie optique et technologies laser »

**1997-2001 : Doctorat** - Faculté de Physique de l'Université de Bucarest, Roumanie et Université Louis Pasteur, Strasbourg, France, doctorat en cotutelle. Spécialité « Physique des matériaux : croissance de couches minces, structure et propriétés »

## Expérience professionnelle:

**1994-1998** : Ingénieur Physicien, Chercheur assistant à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie ; Type ou secteur d'activité : recherche ; Microscopie électronique analytique (TEM, SEM), XRD, croissance de couches minces par PVD, PLD

**1998-2001**: Ingénieur Physicien, Chercheur scientifique à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie; Type ou secteur d'activité: recherche; Microscopie électronique analytique (TEM, SEM), XRD, croissance de couches minces par PVD, PLD

**2001-2005**: Ingénieur Physicien, Chercheur scientifique 3<sup>ème</sup> rang à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie; Type ou secteur d'activité: recherche; Microscopie électronique analytique (TEM, SEM), XRD, croissance de couches minces par PVD, PLD, sol-gel

**2005-2008** : Ingénieur Physicien, Chercheur scientifique 2<sup>ème</sup> rang à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie ; Type ou secteur d'activité : recherche ; Microscopie électronique analytique (TEM, SEM), XRD, croissance de couches minces par PVD, PLD, sol-gel

**2008-2009**: Ingénieur Physicien, Chercheur scientifique 1<sup>er</sup> rang à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie; Type ou secteur d'activité: recherche; Microscopie électronique analytique (TEM/HRTEM, STEM, SEM, EDS, EELS)

**2010-présent**: Ingénieur Physicien, Chercheur scientifique 1<sup>er</sup> rang, responsable du Laboratoire de Structures Atomiques et Défauts en Matériaux Avancés (<a href="http://lab50.infim.ro">http://lab50.infim.ro</a>) à l'Institut National de Physique des Matériaux, Măgurele, Roumanie; Type ou secteur d'activité: recherche; Microscopie électronique analytique (TEM/HRTEM, STEM, SEM, EDS, EELS)

Langues étrangères: Français, Anglais

## Expérience scientifique à l'étranger :

- Nov. 1994 Mar. 1995, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (France), bourse BGF-DEA, formation dans la microscopie électronique à haute résolution.
- Nov. 1998 Jan. 1999, Laboratoire EMAT Université d'Anvers (Belgique), stage de recherche dans le projet Inco-Copernicus "In-situ formation and structural characterization by transmission electron microscopy of semiconductor devices", concernant des études par microscopie électronique sur les réactions chimiques en phase solide par chauffage in situ;
- 1997 2000, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (France) 4 mois de stage par an pour des études doctorales en cotutelle sur de couches minces de manganites à effet magnétorésistif colossal obtenues par ablation laser ;

- 2001 soutenance de la thèse de doctorat intitulée "Etude de couches minces déposées par ablation laser: Manganites à magnétorésistance colossale ( $La_{0,6}Y_{0,07}Ca_{0,33}MnO_{3-\delta}$ " à l'Université de Bucarest, Roumanie et l'Université Louis Pasteur, Strasbourg, France;
- 02-08.06.2002, école de traitement d'images HRTEM, TIMS 2002, Ile de Porquerolles (France);
- Nov. 2001 Sep. 2002, post-doc à l'Université Claude Bernard Lyon I, France, pour des études par microscopie électroniques sur des structures OLED;
- 2003-2007 plusieurs stages entant que chercheur visiteur au laboratoire EMAT Université d'Anvers (Belgique), cumulant 18 mois ;
- 15.05-14.06.2016 bourse post-doc BGF : Effet de la réduction de taille, de la forme et des caractéristiques des interfaces sur la structure et les propriétés des matériaux nanostructurés

**Publications :** ISI Web of Science – 124 articles enregistrés ; nombre de citations (sans autocitations) : 1110 ; hindex : 19.